# 5. Blatt

# Fachgebiet Architektur eingebetteter Systeme **Rechnerorganisation Praktikum**



Ausgabe: 20. November 2023

Abgaben 

Theorie 26. November 2023

Praxis 03. Dezember 2023

Rücksprache 04./05. Dezember 2023

Dies ist das 1. Aufgabenblatt mit Theorie!

Beachten Sie die Abgabetermine im Kopf dieser Seite.

Laden Sie Ihre gelösten Theorieaufgaben entsprechend der Aufgabenblatt-Nr. X und der Aufgaben-Nr. Y in die vorgegebene Datei blatt X/theorie/Aufgabe Y.md ins Gitlab hoch.

## Aufgabe 1: VHDL-Attribute (2 Punkte)

Mithilfe von Attributen kann in VHDL auf bestimmte Eigenschaften von Signalen zugegriffen werden. Informieren Sie sich zum Beispiel in [1] oder [2] über Attribute in VHDL und beantworten Sie die folgenden Fragen:

- 1. Wie greifen Sie auf das Attribut eines Signals zu? Geben Sie die Syntax anhand eines Beispiels an.
- 2. Nennen Sie drei der im Standard vordefinierten Attribute und erklären Sie kurz, was sie repräsentieren.
- 3. Über welche Attribute erhält man den Gültigkeitsbereich des Index für Signale des Typs std\_logic\_vector?
- 4. Wie kann man in VHDL mithilfe von Attributen eine positive bzw. negative Flanke eines Signals detektieren? Geben Sie die entsprechenden VHDL-Anweisungen an.

## Aufgabe 2: Schaltwerke (4 Punkte)

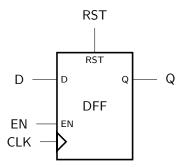


Abbildung 1: D-Flip-Flop inkl. rst und en

Name	Typ	Art	Beschreibung
D	std_logic	in	Datum, welches zum Speichern anliegt
CLK	std_logic	in	Takt, bei dessen steigender Flanke gespeichert werden soll
EN	std_logic	in	Flag, bei '1' soll gespeichert werden
RST	std_logic	in	Zurücksetzen des Flip-Flops bei '1'
Q	std_logic	out	Datum, welches gespeichert ist

Schaltwerke sind digitale Funktionsgruppen, deren Ausgangssignale nicht nur von aktuellen Eingangssignalen, sondern auch von den in der Vergangenheit aufgetretenen Zuständen abhängen. Taktflankengesteuerte D-Flip-Flops stellen die Grundlage der meisten Schaltwerke dar. Das Verständnis der Modellierung der D-FFs ist daher unverzichtbar. In dieser Übung soll dieses Verständnis erworben bzw. vertieft werden.

1. (2 Punkte) Implementieren Sie für die vorgegebene Entity-Spezifikation dff die Architektur behavioral in der Datei dff. vhd, welche das Verhalten eines flankengesteuerten D-FFs nachbildet.

Die **synchrone** Reaktion des FF-Ausgangs auf eine steigende Flanke wird innerhalb einer *if*-Anweisung beschrieben. Erinnern Sie sich dazu an die ensprechende Theorieaufgabe.

Testen Sie ihre Implementierung mit der Testbench dff\_tb.

2. (2 Punkte) Taktflankengesteuerte Register lassen sich nach denselben Regeln entwerfen wie taktflankengesteuerte FFs. Die Datenein- und Ausgangssignale haben jedoch den Typ std\_logic\_vector.

Implementieren Sie für die gegebene Entity-Spezifikation reg eines flankengesteuerten Registers mit generischer Breite die Architektur behavioral in der Datei reg. vhd. Das Register soll außerdem um ein **synchrones** Rücksetzsignal rst und um ein **synchrones** Aktivierungssignal en erweitert werden. Beide Signale sind high-aktiv, das heißt, ihre Funktion ist aktiviert, wenn an dem entsprechenden Eingang eine logische 1 anliegt. Wenn das Rücksetzsignal gesetzt ist, sollen alle Bits des Registers auf 0 gesetzt werden. Bei gesetztem Aktivierungssignal werden die Daten vom Eingang des Registers in die einzelnen D-Flip-Flops übernommen.

Validieren Sie das Verhalten des Registers mit der vorgegebenen Testbench req\_tb.

### Aufgabe 3: RAM (4 Punkte)

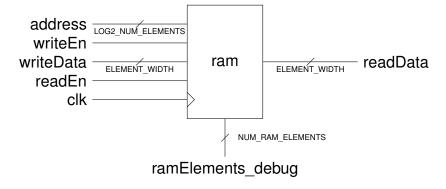


Abbildung 2: Entity ram

Name	Тур	Art	Beschreibung
clk	std_logic	in	Taksignal zum synchronen Betrieb des RAMs
address	std_logic_vector (LOG2_NUM_ELEMENTS - 1 downto 0)	in	Adresse, an die geschrieben/gelesen werden soll
writeEn	std_logic	in	Flag, bei '1' soll geschrieben werden
writeData	std_logic_vector (ELEMENT_WIDTH - 1 downto 0)	in	Speicherelement, das geschrieben werden soll
readEn	std_logic	in	Flag, bei '1' soll gelesen werden
readData	std_logic_vector	out	Speicherelement, das gelesen wurde
	(ELEMENT_WIDTH - 1 downto 0)		

Tabelle 1: Entity-Ports

Name	Typ	Art	Beschreibung
NUM_ELEMENTS	integer	generic	Anzahl der Speicherelemente des RAMs
LOG2_NUM_ELEMENTS	integer	generic	Zweier-Logarithmus des oben genannten
			Parameters
ELEMENT_WIDTH	integer	generic	Breite eines einzelnen Speicherelements

Tabelle 2: Entity-Generics

Name	Typ	Art	Beschreibung
ramElements_debug	ram_elements_type	out	Debug-Port für den Zugriff auf den RAM- Inhalt

Tabelle 3: Entity-Debug

Für sehr viele Anwendungen wird Speicher zum Beispiel in Form von externen RAM-Bausteinen verwendet, da die Kapazität der RAM-Blöcke innerhalb eines FPGA begrenzt ist. Um während der Designphase einen derartigen Baustein simulieren zu können, ist ein entsprechendes Modell zu implementieren.

Eine prinzipielle Speicherkomponente mit den notwendigsten Signalen ist der Abbildung 2 zu entnehmen. Soll ein Datum gelesen werden, so muss das readEn-Signal gesetzt werden. Beim Schreiben ist dementsprechend die writeEn-Leitung zu aktivieren. Bei beiden Aktionen wird die Adresse durch die Daten auf den address-Leitung definiert. Gleichzeitiges Schreiben und Lesen ist möglich. In diesem Fall soll der Schreibvorgang zuerst erfolgen, damit die aktualisierte Speicherzelle noch in demselben Takt gelesen werden kann. Die Breite der zu speichernden Daten wird generisch über den Parameter ELEMENT\_WIDTH gesteuert. Die Anzahl der Speicherelemente ist dem Parameter NUM\_ELEMENTS zu entnehmen. Die notwendige Adressbreite wird über LOG2\_NUM\_ELEMENTS angegeben. Das Schreiben soll synchron erfolgen. Der ramElements\_debug-Port ermöglicht der Testbench das Auslesen des RAM-Inhalts, ohne dass der Leseport funktionieren muss. Dieser Debug-Port muss in ihrer Beschreibung nicht weiter berücksichtigt werden.

1. Implementieren Sie das Speichermodell in der Architektur behavioral für die vorgegebene Entity-Spezifikation ram in der Datei ram. vhd und testen Sie Ihr Design mit der zur Verfügung gestellten Testbench ram\_tb.

### Literatur

- [1] Gunther Lehmann, Bernhard Wunder, and Manfred Selz. Schaltungsdesign mit VHDL, 1994.
- [2] A. Mäder. VHDL Kompakt.
- [3] ROrgPr Team. Rorgpr Übersicht. https://rorgpr.gitlab-pages.tu-berlin.de/material/.